

TUZ Call for Papers 2025



Berlin, 23. bis 25. Februar 2025

37. ITG / GMM / GI - Workshop Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen

Programmkomitee

J. Alt
Infineon Technologies AG
H. Amrouch
TU München
B. Becker
Universität Freiburg
R. Drechsler
Uni Bremen und DFKI
S. Eggensglüb,
Siemens Digital Industries Software
P. Engelke
Infineon Technologies AG
G. Fey
TU Hamburg
A.-P. Fonseca Müller
Bosch Sensortec GmbH
M. Gössel
Universität Potsdam
S. Hellebrand
Universität Paderborn
K. Hofmann
TU Darmstadt
S. Holst
Kyushu Institute of Technology
W. Hoppe
Rheinmetall AG
S. Huhn
Siemens Digital Industries Software
M. Kampmann
Siemens Digital Industries Software
R. Krenz-Baath
TH Wildau
M. Krstic
Uni Potsdam und /IHP GmbH
V. Petrovic
HOL Design House
L. Bolzani Poehls
RWTH Aachen
J. Polian
Universität Stuttgart
F. Pöhl,
Frank Poehl Consulting
S. Sattler
Uni Erlangen-Nürnberg
M. Sauer
Advantest Europe GmbH
M. Schillinsky
NXP Semiconductors Germany GmbH
H. Schmidt
IBM Deutschland GmbH
M. Schözel Hochschule Nordhausen
J. Sepulveda
Airbus Defence and Space
M. Tahoori
KIT
D. Tille
Siemens Digital Industries Software
M. Wahl Universität Siegen
H.-J. Wunderlich
Universität Stuttgart
F. L. Vargas
IHP GmbH

Der Workshop „Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen“ ist das bedeutendste deutschsprachige Forum, um Trends, Ergebnisse und aktuelle Probleme auf dem Gebiet des Tests, der Diagnose und der Zuverlässigkeit digitaler, analoger, Mixed-Signal- und HF- Schaltungen zu diskutieren. Der Austausch von Ideen ist ein wichtiges Anliegen des Workshops. Erwünscht sind sowohl Beiträge aus der industriellen Praxis als auch von Forschungseinrichtungen. Wir begrüßen stark praxisbezogene Erfahrungsberichte und Ergebnisse ebenso wie Beiträge zu theoretischen Themen unter anderem aus folgenden Bereichen:

- Adaptive Systeme (z.B. Selbstreparatur, self-healing, self-awareness)
- Automatisches Test-Equipment, Testautomatisierung, Testprogramme und Testmodellierung
- Defekt- und Fehlermodellierung
- Diagnose von Ausfallursachen
- Fehlertoleranz, Resilienz, Robuste und strahlenresistente Systeme
- Funktionale Sicherheit
- Hardware-orientierter Test und Hardware-orientierte Sicherheit
- Statistische und KI-Lernverfahren für Test und Zuverlässigkeit
- Test und Simulation von Mixed-Signal, HF- und Analog-Schaltungen
- Testerzeugung, Fehlersimulation, Selbsttest und Online-Test
- Testgerechter Entwurf, DFT Methodik
- Testkosten und Qualität
- Teststandards, z.B. IEEE 1149.x, IEEE 1687.x, IEEE 1838

Der Workshop findet im Konferenzhotel Müggelseeperle in Berlin-Köpenick statt und wird von der Technischen Hochschule Wildau in Zusammenarbeit mit dem IHP organisiert. Es ist geplant die Veranstaltung vollständig in Präsenz durchzuführen. Interessenten werden gebeten, die Zusammenfassung ihres Beitrags im Umfang von maximal 2 Seiten über die Workshop-Homepage einzureichen. Der Beitrag sollte den Zweck der Arbeit, den Neuigkeitsgehalt und Aspekte der Anwendung beschreiben. Angenommene Beiträge werden auf Wunsch in den informellen Workshop-Handout aufgenommen. Hierzu kann der Beitrag auf 4 Seiten erweitert werden.



Workshop-Homepage

www.tuz-workshop.de
Submission-Seite
<https://easychair.org/conferences/?conf=tuz25>

Wichtige Termine

Einreichung von Abstracts: 10.11.2024
Einreichung finaler Beiträge: 17.11.2024
Benachrichtigung der Autoren: 20.12.2024
Camera-ready-paper: 18.01.2025

Tagungsleitung

Prof. Dr. René Krenz-Baath
TH Wildau
E-Mail: rene.krenz-baath@th-wildau.de

Programmkomitee-Vorsitzender

Prof. Dr.-Ing. Milos Krstic
IHP – Leibniz Institut für innovative Mikroelektronik
E-Mail: krstic@ihp-microelectronics.com;

Veranstalter

GIFA3.5/GMMFA6.5/ITGFA8.2RSS Kooperationsgemeinschaft rechnergestützter Schaltungs- und Systementwurf



GMM

VDE ITG